

데이터분석및실험 기말과제

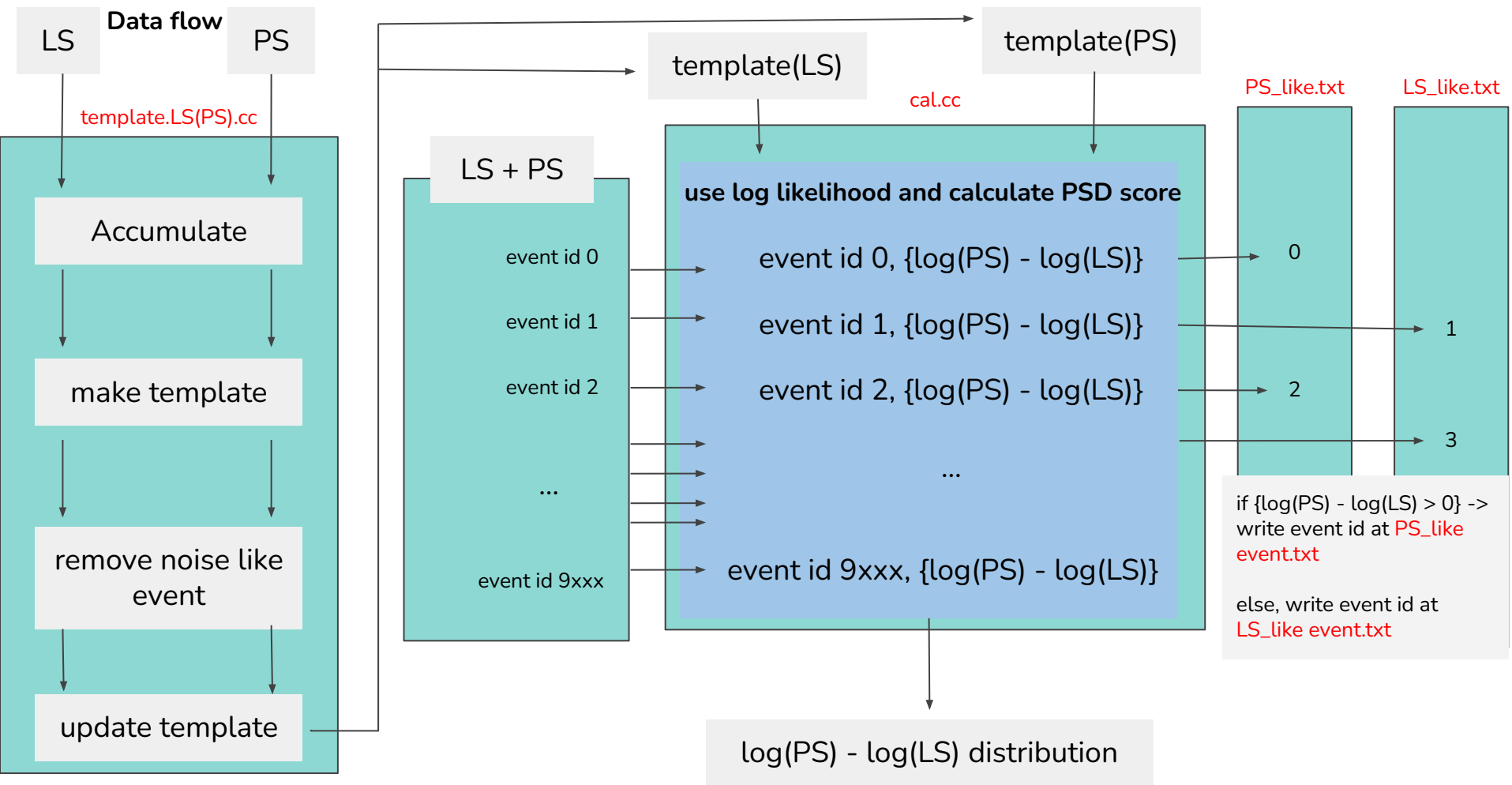
2022220206 김종업





Content

- Accumulate & Make template
- Remove noise like event & update template
 - convolution
 - total charge
 - update template
- Log likelihood
- PSD score



Accumulate & Make template

Accumulate & Make template

```
// event loop
for(int i = 0; i < total ; i++){
    vector<double> tempList(40);
    chain->GetEntry(i);
    ped = 0 ; Qtotal = 0 ;
    ped_count = 0; peak_bin = 0;
    cnt = 0 ;
    value = 0 ;

    // pedestal loop
    for(int jj = 0 ; jj < hist_point; jj++){
        his->SetBinContent(jj+1,fadc0[jj]);

        if (jj >= 0 & jj < 1100){
            ped += fadc0[jj];
            ped_count++;
        }
    }
    ped /= (double)ped_count; // normalize pedestal
    peak_bin = his->GetMaximumBin();

    //Qtotal loop
    for(int jj = peak_bin - 10 ; jj < peak_bin + 30 ; jj++) Qtotal += fadc0[jj] - ped;
    Qtotal_list[i] = Qtotal ;

    // calculate the bin content using pedestal
    for(int jj = peak_bin - 10 ; jj < peak_bin + 30 ; jj++){
        value = (double)(fadc0[jj] - ped) ;
        tempList[cnt] = value ;
        cnt ++ ;
    }

    vecOfVecs[i] = tempList;
}
```

- 각 이벤트마다 pedestal 제외.
- 전압 최대치가 되는 bin 을 기준으로 -10 에서 +30 만큼 템플릿을 제작할 범위를 설정.
- 이후 각 이벤트의 bin content 에 대한 정보를 vector 에 저장.



Accumulate & Make template

각 이벤트의 waveform 정보를 저장한

2차원 벡터(vecOfVecs 변수) **accumulate**

```
//make template
for (int j = 0 ; j < 40 ; j ++){
    sum = 0 ;
    for (int i = 0 ; i < total ; i++){ sum += vecOfVecs[i][j];
    LS_accu→SetBinContent(j+1,sum);
}
LS_accu→Scale(1.0/LS_accu→Integral());
for (int i = 0 ; i < 40 ; i++) temp[i] = LS_accu→GetBinContent(i+1);
```

$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$, [], [], [] (event id 0)
+
[x_2], [], [], [] (event id 1)
+
[x_3], [], [], [] (event id 2)
+
[x_4], [], [], [] (event id 3)
+
[x_5], [], [], [] (event id 4) ..

-> 첫번째 bin content 의 총합.

Remove noise like event & Update template



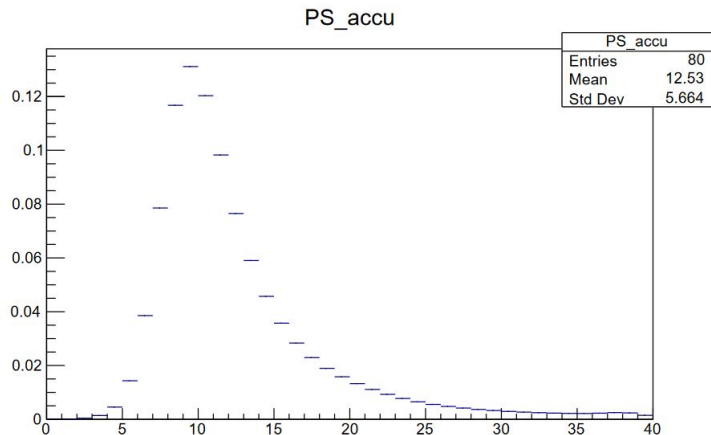
Remove noise like event & Update template

- convolution 과 , total charge 에 대한 하한선을 LS , PS 데이터 파일에 적용하여 noise like 이벤트를 제거.
- 이후, signal like event 의 정보만을 이용하여 템플릿을 업데이트.

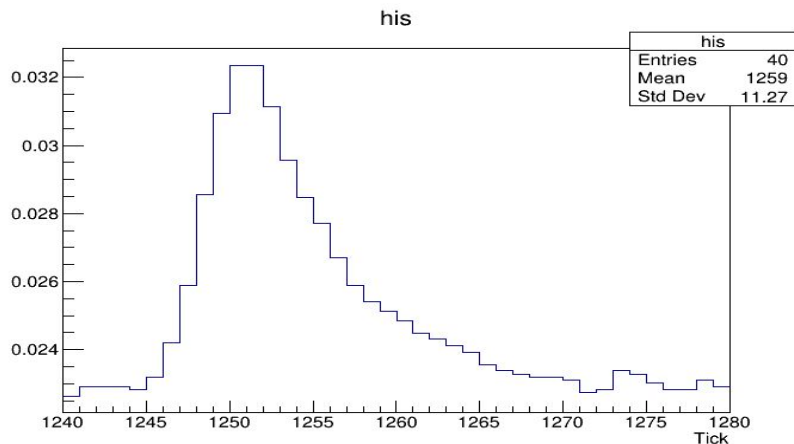


Convolution

signal like event의 경우, 템플릿과의 Convolution 형태가 일정하고 높은 피크를 보이는 것을 이용하여, Convolution 최대값이 낮은 이벤트를 제외하고 템플릿을 다시 제작.



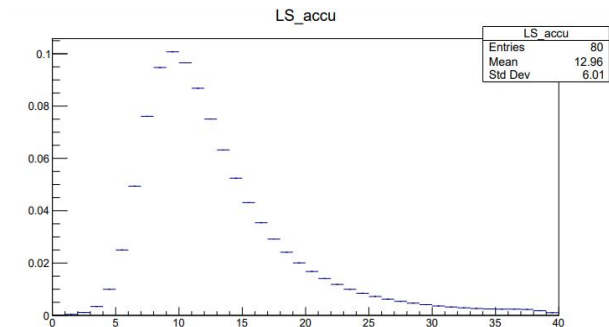
각 이벤트마다 (peak bin - 10) ~ (peak bin + 30) 범위 내의 waveform 을 축적하여 만든 PS 데이터의 템플릿.



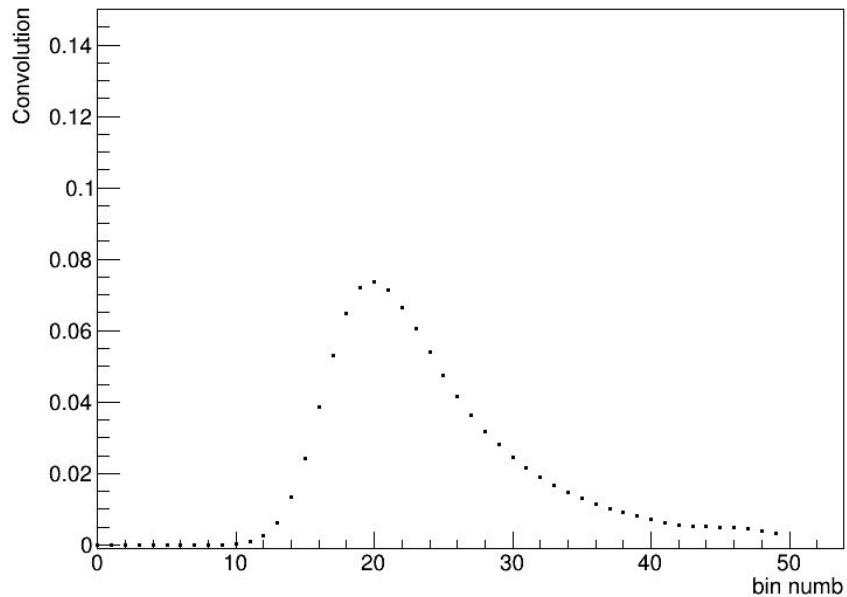
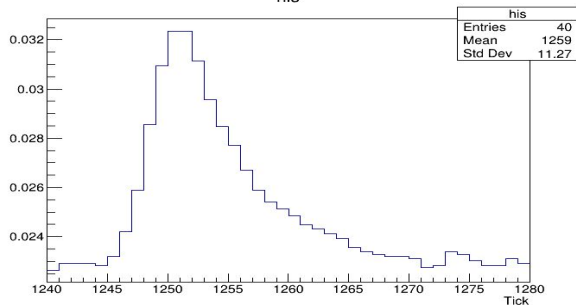
PS 데이터 의 특정 이벤트의 (peak bin - 10) ~ (peak bin + 30) 범위 내의 waveform



Convolution



his

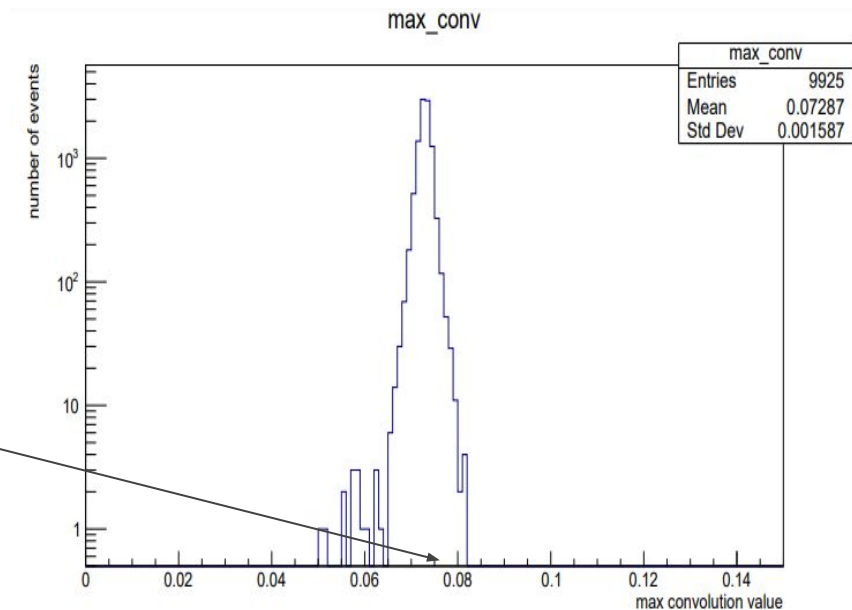
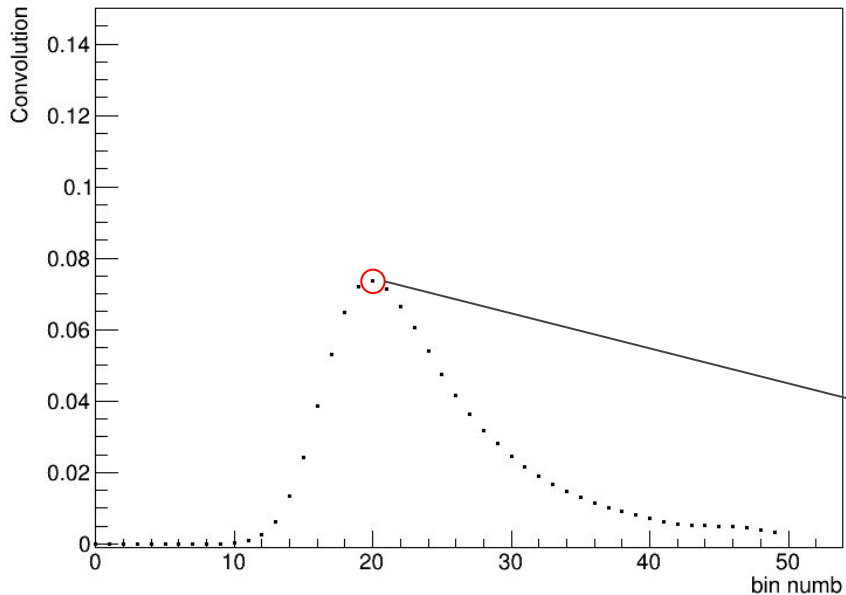


Convolution 결과



Convolution

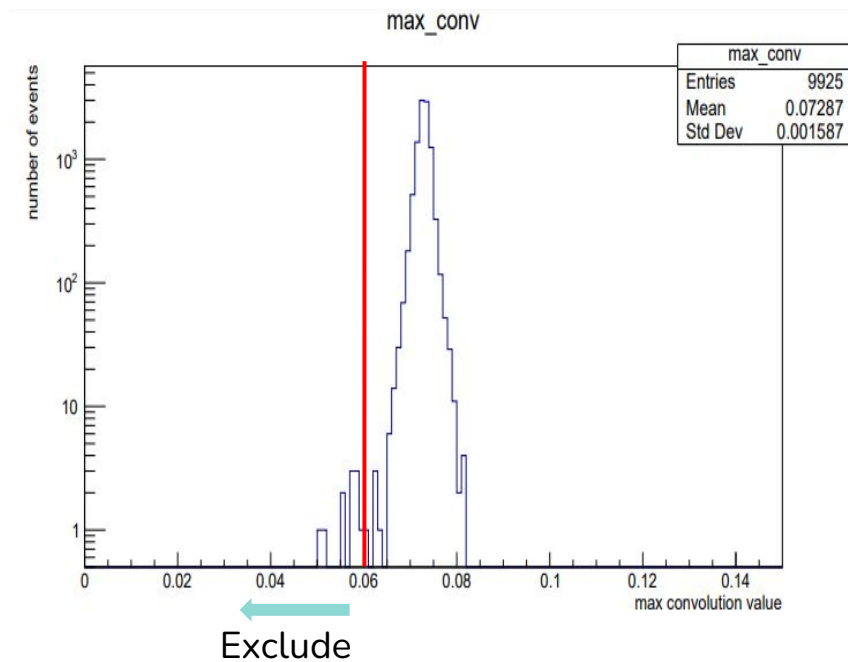
Convolution 최대값의 분포도를 제작.





Convolution

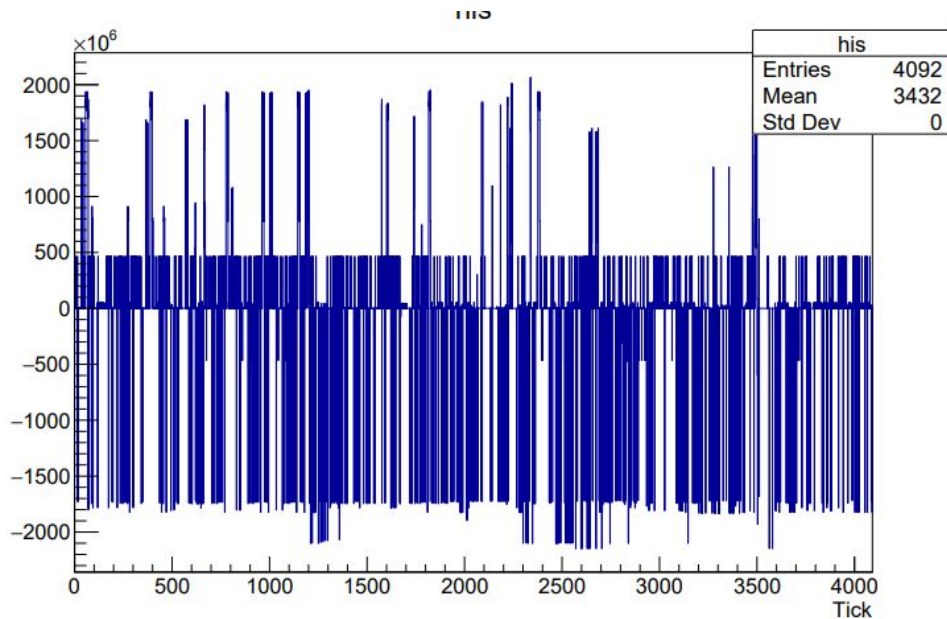
낮은 Convolution 최대값을 가지는 이벤트들을 제외 (0.6 이하)



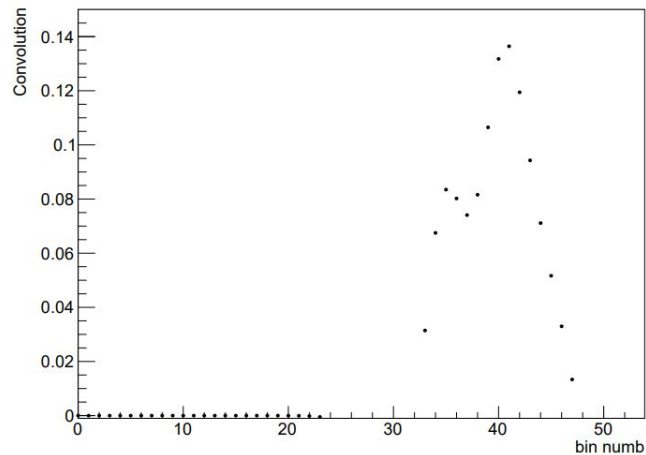


Convolution

PS 파일의 event id = 7711 데이터



Convolution 패턴이 다른 경우.

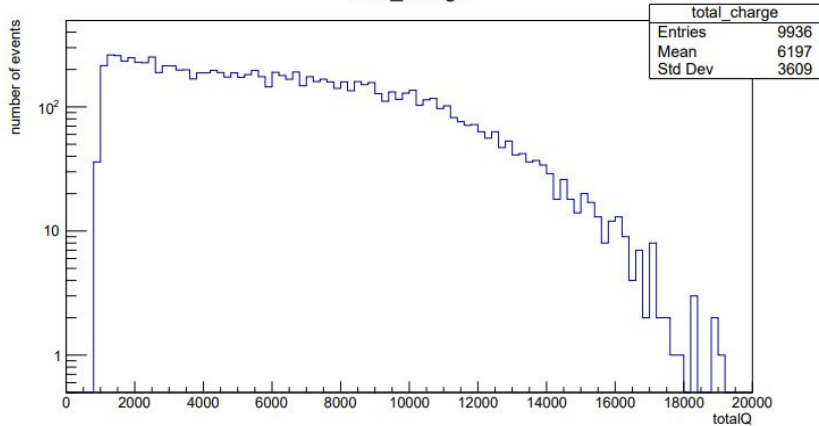




Total charge

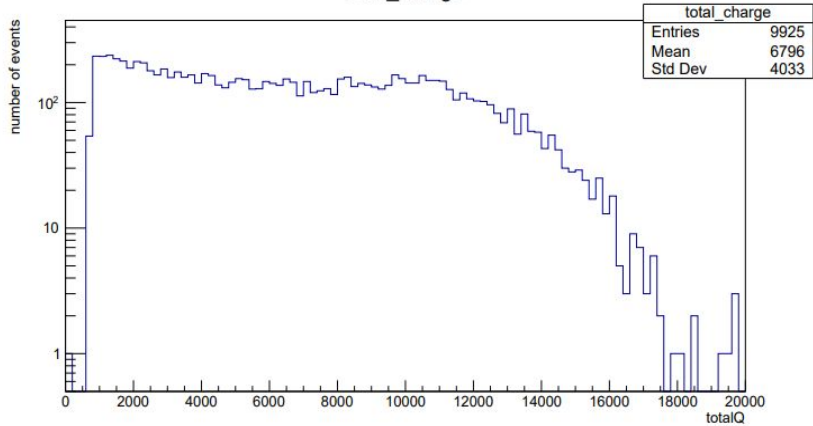
하위 5%의 total charge를 가지는 이벤트를 제외.(LS의 경우, 1400 이하, PS의 경우, 1200 이하)

total_charge



LS 데이터의 total charge 분포도

total_charge



PS 데이터의 total charge 분포도



Update Template

```
// apply cut
for (int i = 0 ; i < total ; i++){
    if ((conv_list[i] < 0.05) || (Qtotal_list[i] < 1400)){
        for (int j = 0 ; j < 40 ; j++) vecOfVecs[i][j] = 0 ;
    }
}

//update template
for (int j = 0 ; j < 40 ; j ++){
    sum = 0 ;
    for (int i = 0 ; i < total ; i++){ sum += vecOfVecs[i][j];
    LS_accu→SetBinContent(j+1,sum);
}
LS_accu→Scale(1.0/LS_accu→Integral());
```

2차원 벡터(vecOfVecs)

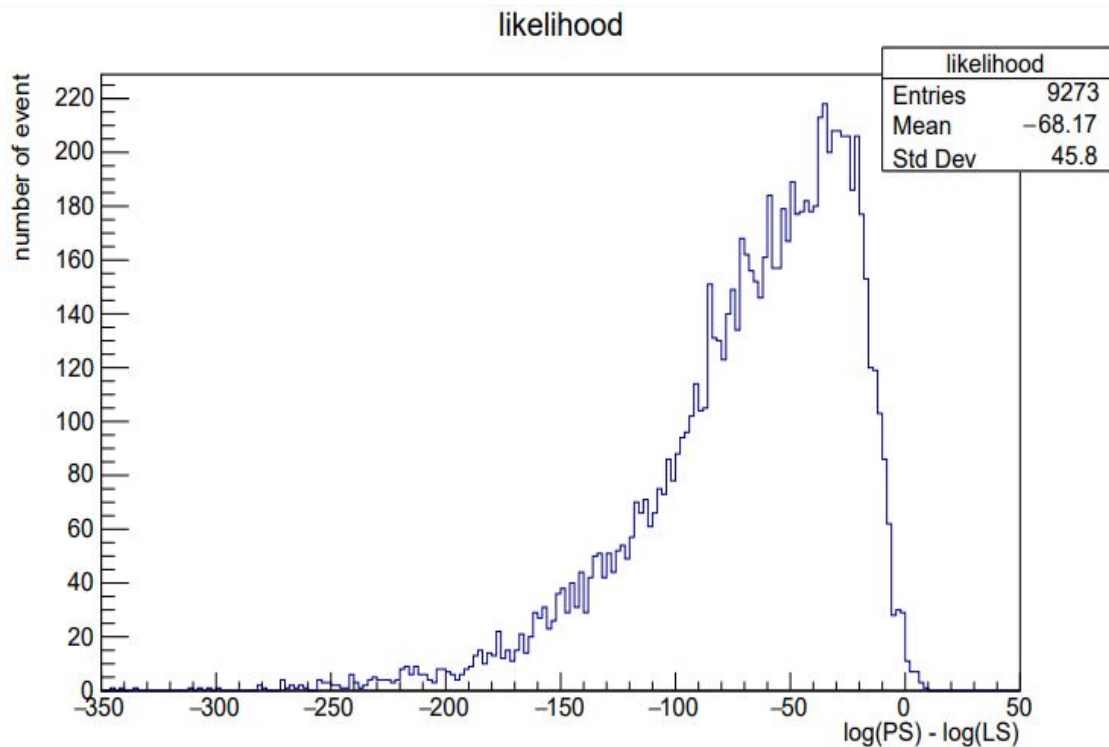
accumulate

[[x₁], [], [], []] (event id 0)
+
[[x₂], [], [], []] (event id 1)
+
~~[[x₃], [], [], []] (event id 2)~~
+
[[x₄], [], [], []] (event id 3)
+
[[x₅], [], [], []] (event id 4) ..

cut 을 통과하지 못한 경우
accumulate 과정에서 제외.
(event id 2 가 통과하지 못한
경우)



Update Template



LS 데이터의 PSD 점수.

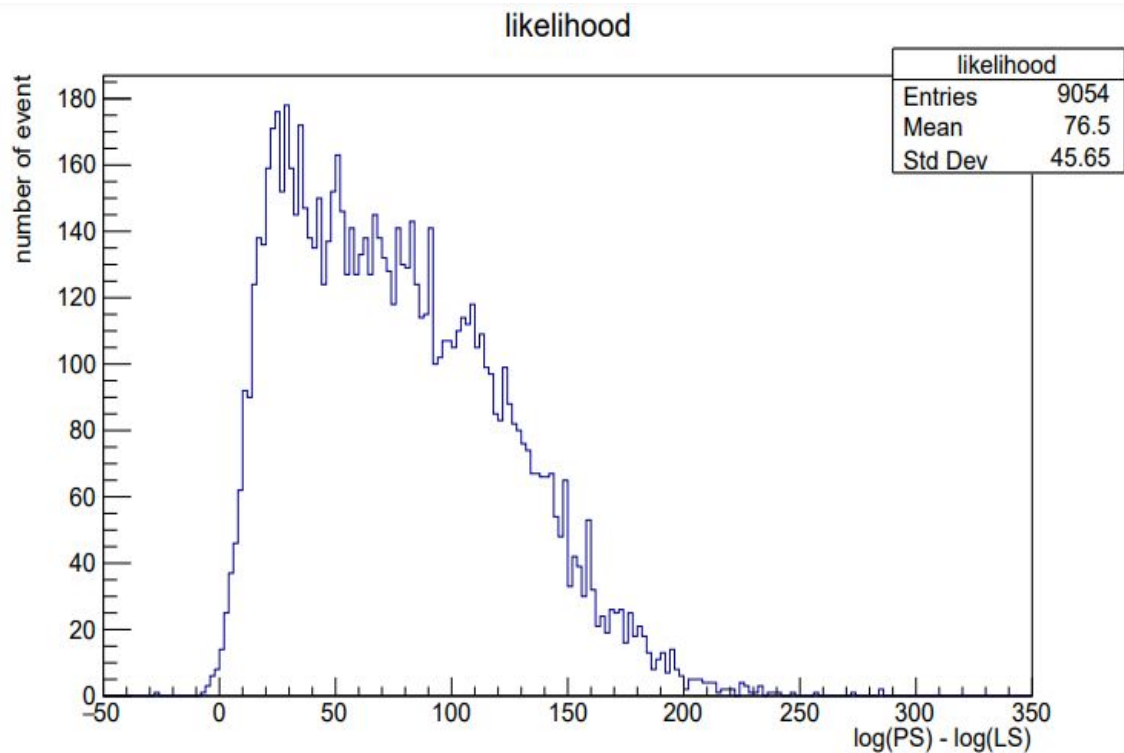
$Q_{\text{total cut}} = 1500$,

오판율 = 0.31 %

root cal_LS.cc 입력 후,
result_LS.root 파일에서 확인가능



Update Template



PS 데이터의 PSD 점수

$Q_{\text{total cut}} = 1500$,

오판율 = 0.43 %

root caL_PS.cc 입력 후,
result_PS.root 파일에서 확인가능

Log Likelihood



Log Likelihood

$$\log[L] = N_i \sum_{i=1}^{nbin} \log[P_i]$$

$\log(L)$ = log likelihood 값, i = bin 번호

N_i = LS+PS 데이터의 i 번째 bin content 값,

P_i = LS, PS 템플릿의 i 번째 bin content 값.



Log Likelihood

$$\log(\text{PS}) = \sum_i^{\text{bin number}} (\text{test event bin content}) * \log_{10}(\text{PS data template bin content})$$

```
if (Qtotal < charge_cut ) continue ;  
// likelihood calculation  
for (int jj = 0 ; jj < 40 ; jj++){  
    total_LS += content[jj] * log10( LS_accu->GetBinContent(jj+1));  
}  
  
for (int jj = 0 ; jj < 40 ; jj++){  
    total_PS += content[jj] * log10(PS_accu->GetBinContent(jj+1));  
}
```

log likelihood 계산을 다음과 같이 수행.



Log Likelihood

PSD 점수 = $\log(\text{PS}) - \log(\text{LS})$

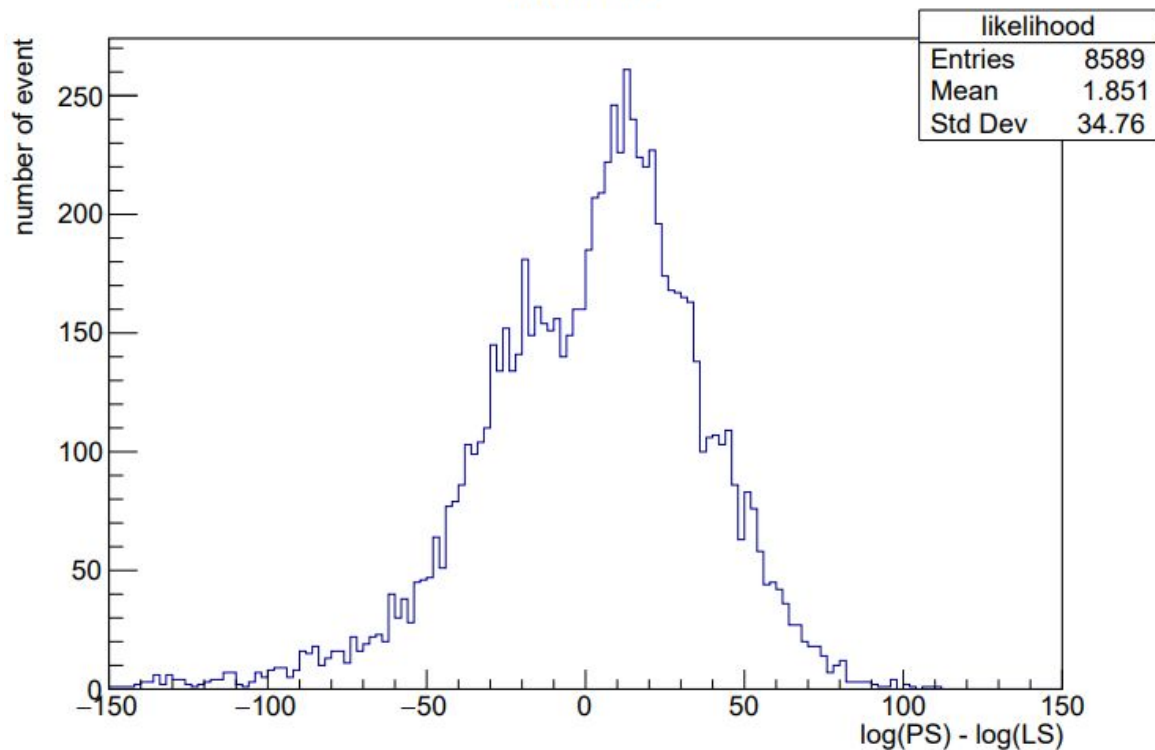
```
if ((total_PS - total_LS) > 0) {  
    file1 << i << endl;  
    PS_like += 1;  
}  
else{  
    file2 << i << endl;  
    LS_like += 1;  
}
```

PSD 점수를 계산하여 PS like 한 이벤트와 LS like한 이벤트의 갯수를 확인.

PSD score distribution

PSD score

likelihood



- LS + PS 데이터에 대한 Q_{total} 컷 : 1500.
- 전체 event 갯수 : 8589
- $\log(\text{PS}) - \log(\text{LS}) > 0$ 인 event 수 : 4875.
- $\log(\text{PS}) - \log(\text{LS}) < 0$ 인 event 수 : 3714.
- event id 에 대한 정보는 txt 파일에 저장.



파일 설명 (Final_exam 디렉토리 위치 기준)

template_LS.cc : LS 디렉토리에 LS 템플릿 생성

template_PS.cc : PS 디렉토리에 PS 템플릿 생성

cal.cc : LS + PS 데이터 log likelihood 계산

cal_LS.cc : LS 데이터 log likelihood 계산

cal_PS.cc : PS 데이터 log likelihood 계산



파일 설명 (Final_exam 디렉토리 위치 기준)

result_LS.root, result_PS.root : LS, PS 데이터의 PSD 점수 분포도

result.root : LS + PS 데이터의 PSD 점수 분포도

LS/LS_accu.root : LS 템플릿, Qtotal, Convolution 최대치 분포도

PS/PS_accu.root : PS 템플릿, Qtotal, Convolution 최대치 분포도

convolution/conv_shape_LS.cc : LS 데이터의 Convolution 확인용 파일

convolution/conv_shape_PS.cc : PS 데이터의 Convolution 확인용 파일



실행 순서

Final_exam 디렉토리에서 다음과 같이 명령어 입력

```
root template_LS.cc
```

```
root template_PS.cc
```

-> PS, LS 디렉토리에 각각 PS, LS 템플릿 생성

이후 root cal.cc 명령어로

PSD 점수 분포도 확인 가능.